

JT33 TDLAS气体分析仪

可靠的H₂S测量，实现更高的产品质量、更优的过程控制和更好的资产完整性



优势:

- 采用经过验证的计量方法进行连续、实时的TDLAS测量，符合测量规范
- 采用坚固耐用的专利差分技术，能够在严苛的应用场景中容忍污染物和气流变化
- 自动验证功能，用于确认现场分析仪的运行状况
- 支持自动存储历史数据、光谱记录、诊断信息以及计量交接应用的验证报告
- 具有卓越准确性和重复性的NIST可溯源工厂校准
- 可现场维修组件和模块，实现最短停机时间和最大维修灵活性
- 友好的人机界面，直观的操作菜单，自带网页服务器软件

产品规格参数

- **分析物和测量范围** H₂S（硫化氢）：0...10 ppmv 0...500 ppmv
其他量程（按需提供）
- **防爆认证** ATEX/IECEX/UKEx Zone 1 CSA Cl. I, Div. 1 CSA Cl. I, Zone 1

应用领域: JT33气体分析仪能够连续进行实时的H₂S测量，且维护需求较低。它使工厂运营和所有者能够满足气体质量标准，改善过程控制，并确保资产完整性。JT33采用了经过验证的差分技术，能够在满足测量性能规格的同时，容忍气流变化。它还具备自动验证功能以及

Heartbeat Technology心跳技

由“术

”支持的高级诊断功能，可用于验证

报告。

特征和规格

H2S

测量原理

TDLAS

通道数

1

分析物和测量范围

H2S (硫化氢) :

0...10 ppmv

0...500 ppmv

其他量程 (按需提供)

测量变量

浓度

采样腔室压力

采样腔室温度

环境温度范围

JT33 TDLAS气体分析仪系统 :

-20...50 °C (-4...122 °F)

-10...60 °C (14...140 °F)

工作压力范围

取决于实际应用

800...1200 mbara (标准)

800...1700 mbara (可选)

分析仪接液部件材质

316L不锈钢

FKM O型圈

玻璃

PCTFE/PTFE

H2S

电源

控制器（光谱传感器）：

100...240 VAC，偏差±10%，50/60 Hz，10 W

24 VDC，偏差±20%，10 W

UM = 250 VAC

样品处理系统电子部件：

100...240 VAC ±10%，50/60 Hz，275 W

UM = 250 VAC

通信

I/O1：Modbus RTU/RS485或Modbus TCP/Ethernet

I/O2和3：继电器输出或通用I/O（UIO）；UIO可配置为模拟量输入/输出（4...20 mA）或数字量/状态输出

服务网页服务器界面：以太网RJ45

外壳材质

电子部件：带涂层无铜铝或铸造不锈钢

样品处理系统外壳：304或316不锈钢

样品处理系统面板：阳极氧化铝

外壳窗口（可选）：聚碳酸酯

防爆认证

ATEX/IECEX/UKEx Zone 1

CSA Cl. I, Div. 1

CSA Cl. I, Zone 1

防护等级

IP66, Type 4X

产品安全

CE

RCM

FCC

CRN

更多信息 www.endress.com.cn/JT33